

NIKON LV150N 사양서

품 명	영문 : Inspection Microscope	규 격	LV150N
	국문 : 고배율현미경		
제조국	일본	제조사	NIKON
고객명	동국대	담당자	

1. NIKON LV150N BD 장비 개요

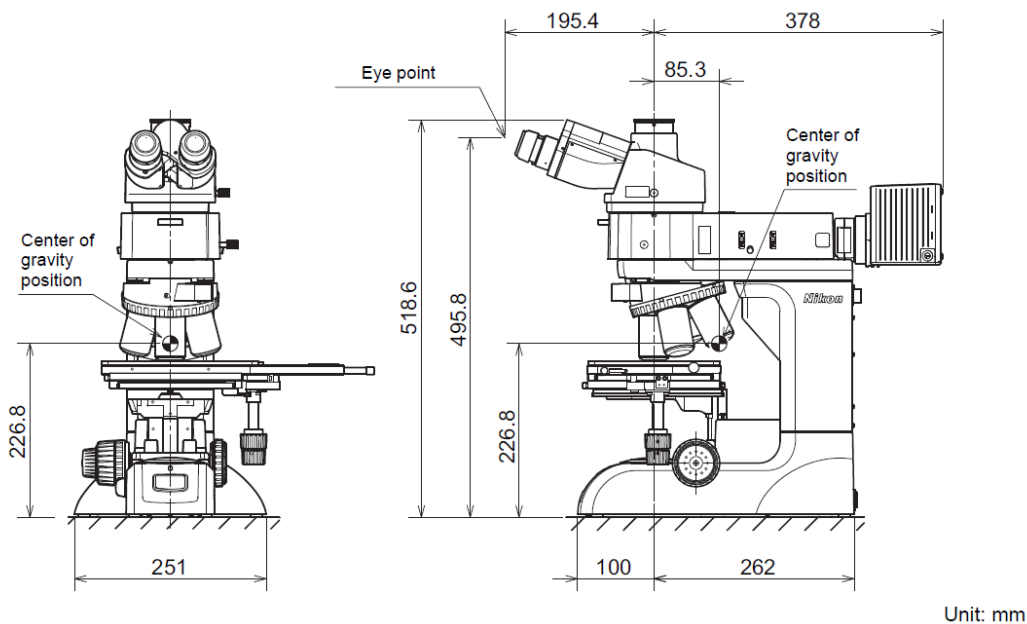
Wafer, Glass, Film 등의 검사, 관찰을 목적으로 구성된 현미경으로, 150 x 150mm 이송 Stage 및 반사 조명장치, 편광필터 및 DIC필터 등이 장착된 Universal Type 다목적 검사 현미경임.

2. 주요구성품 및 외관

1) 구성품

- ① Microscope Main Body
- ② Optical Head
- ③ LED Illuminator light source
- ④ Objective Lens 10x, 20x, 50x, 100x Bright Field
- ⑤ 이송 Stage
- ⑥ 이미지 분석 및 측정용 Digital camera & analysis software
- ⑦ 제어용 PC
- ⑧ 측정 및 분석 S/W
- ⑨ 630만 화소 카메라

2) 시스템 외관도



3. 특징

- 1) 긴 작동거리(Working Distance)의 50x, 100x 렌즈. (각각 11mm, 4.5mm)
- 2) 편심이 적은 대물렌즈와의 조합으로 고배율 관찰시에도 상이 명확하고, 안정된 상태로 관찰 가능.
- 3) 본체, 이송 Stage, 경통 등 제전 방지 처리를 하여, 정전기에 의한 Sample의 손상방지 및 수율 향상.
- 4) 편광 필터 및 DIC 필터 장착으로 다양한 관찰 및 특성 분석 가능
- 5) 630만 화소의 CMOS 카메라 장착으로 고해상도 이미지 획득 및 측정 가능
- 6) LED 광원을 사용하여 램프 교체 불필요
- 7) Wafer Holder 장착으로 다양한 크기의 Wafer 관찰 시 정렬 및 이동 용이

4. 표준 사양표

MODEL		LV150N BD
본체부	관찰모드	명시야, 편광, 미분간섭 관찰 조동, 미동 조절 Knob
	광학헤드	정립 3안 Tilting Head, Port 100:0/0:100
	조명부	반사 전용 명시야: LED Lamp
	접안렌즈(시야)	10X(FOV 22mm or 25mm)
	Revolver	본체 내장 형 5구 Revolver
	대물렌즈	TU Plan FLUOR EPI 5x (NA/WD : 0.15/23.5mm) TU Plan FLUOR EPI 10x (NA/WD : 0.30/17.5mm) TU Plan FLUOR EPI 20x (NA/WD : 0.45/4.5mm) TU Plan FLUOR EPI 50x (NA/WD : 0.6/11mm) TU Plan FLUOR EPI 100x (NA/WD : 0.80/4.5mm)
스테이지	Stroke	150 x 150 mm
Camera		630만 화소 CMOS (USB 3.0) SONY IMX178 1/1.8" CMOS 30fps @3072 x 2048 38fps @1536 x 1024
S/W		Live Capture / Measuring tools / Multi-focus
정전 방지		1000-10V, within 0.2sec
Filter		편광필터, DIC 필터
무게		Approx. 8.6Kg
외관치수		251 x 362 x 519 mm
소비전력		1.2A/75W